

SRMS-Verzeichnis

Akkreditierungsnummer: SRMS 0006

Internationale Norm: ISO 17034:2016
Schweizer Norm: SN EN ISO 17034:2017

Suisse Technology
Partners AG
Querstrasse 5
8212 Neuhausen

Leiter: Dr. Benedikt Moser
MS-Verantwortliche: Claudia Oschwald
Telefon: +41 52 511 11 00
E-Mail: info@suisse-tp.ch
Internet: <https://suisse-tp.ch>
Erstmals akkreditiert: 12.01.2023
Aktuelle Akkreditierung: 12.01.2023 bis 11.01.2028
Verzeichnis siehe: www.sas.admin.ch
(Akkreditierte Stellen)

Geltungsbereich der Akkreditierung ab 12.01.2023

Hersteller von Aluminium-Referenzmaterialien und von zertifizierten Aluminium-Referenzmaterialien

Referenzmaterialmatrix / Referenzmaterialartefakt	Charakterisierte Merkmale	Art	Verwendeter Ansatz für die Zuweisung der Merkmalswerte
LEGIERUNGEN - Aluminiumbasislegierungen	Massenanteil der Hauptelemente (ausser Aluminium) und Nebenelemente	RM, CRM	Quantitative Bestimmung mittels Funken-OES, ICP-OES, ICP-MS, Flammen-AAS, Photometrie, Kaltdampf-AAS (b, d) ¹

Bei Widersprüchen in den Sprachversionen der Verzeichnisse gilt die deutsche Fassung.

¹ Kategorien entsprechend der Norm SN EN ISO 17034:2017 Abs. 7.12.3:

- Anwendung eines einzelnen Referenzmessverfahrens (wie in ISO/IEC Guide 99 definiert) in einem einzelnen Laboratorium
- Charakterisierung einer nicht verfahrensbezogenen Messgröße unter Verwendung von zwei oder mehr Verfahren mit nachweisbarer Genauigkeit in einem oder mehreren kompetenten Laboratorien
- Charakterisierung einer verfahrensbezogenen Messgröße unter Verwendung eines Netzwerks kompetenter Laboratorien
- Übertragung von Werten zwischen einem RM und einem eng auf dieses abgestimmten RM Kandidaten, die durch ein Laboratorium unter Anwendung eines einzelnen Verfahrens durchgeführt wird
- Charakterisierung basierend auf Masse oder Volumen der Bestandteile, die bei der Vorbereitung des RMs verwendet werden



SRMS-Verzeichnis

Akkreditierungsnummer: SRMS 0006

Abkürzung	Bedeutung
AAS	Atomabsorptionsspektrometrie
CRM	Zertifiziertes Referenzmaterial
Funken-OES	Optische Emissionsspektrometrie mit Funken-Anregung
ICP-MS	Induktiv gekoppeltes Plasma Massenspektrometrie
ICP-OES	Induktiv gekoppeltes Plasma Optische Emissionsspektrometrie
RM	Referenzmaterial

* / * / * / * / *